

Twée oorkondes

voor Frans Holthuysen

Falco van Delft, WAG0324, tel. 43124

'(T)he(y) did it again! (and again!)' Aldus de woorden van de voorzitter van de jury. Op de Electron, Ion, and Photon Beam and Nanotechnology conference, die dit jaar eind mei gehouden werd in Palm Springs, California, is Philips Research wederom in de prijzen gevallen bij de jaarlijkse Micrograph Contest.

Frans Holthuysen, specialist op het gebied van 'scanning electron microscopy' (SEM) in de dienst DTS (cleanroom WA) heeft dit keer maar liefst twee prijzen in de wacht gesleept, een unieke prestatie! Op 3 november heeft Gerrit Koel, hoofd van de sector Operations & Engineering, tijdens een feestelijke bijeenkomst hem de oorkondes overhandigd

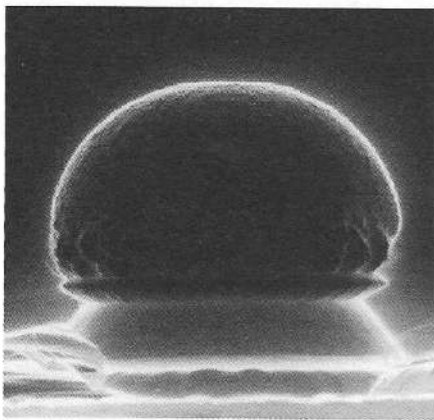


voor de categorieën 'Best Electron Micrograph' en 'Most Bizarre Micrograph'. Frans, van harte gelukgewenst met dit mooie resultaat. Hopelijk zal Frans ook voor de volgende Micrograph Contest weer voorzien

worden van voldoende (soms mislukte) 'samples', waarop hij zijn technische en artistieke vaardigheden kan botvieren.

16

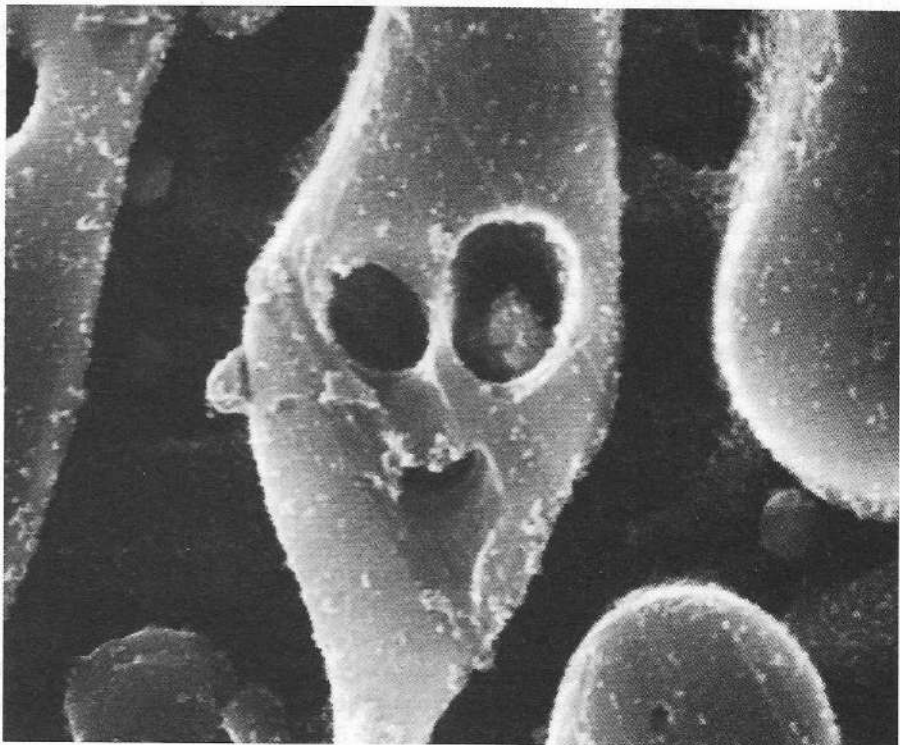
Nat.Lab. Journaal • 24 nov. 2000



Nano-bomb: een geëist gat in monokristallijn silicium

Two certificates for Frans Holthuysen

On the Electron, Ion, and Photon Beam and Nanotechnology conference in Palm Springs, California, SEM specialist Frans Holthuysen was again successful at the yearly Micrograph Contest. This time, he won even two prizes: in the categories 'Best Electron Micrograph' and 'Most Bizarre Micrograph'.



Nano-encounter: doorsnede van een multilaag, bestaande uit reactief gemodificeerd perspex en polystyreen

Kopij-data

'Deadlines' voor het inleveren van kopij:

- voor NLJ jrg.11, nr. 23 van 8 dec 2000: 27 nov
- voor NLJ jrg.11, nr. 24 van 22 dec 2000: 11 dec

Kopij s.v.p. bij voorkeur aanbieden via E-mail:

- Karen.Mauve@philips.com
- Nelleke.Tops@philips.com